

FISCHERSCOPE®-X-RAY XDLM®

XDLM是一款应用广泛的能量色散型x射线光谱仪。从已大众认可的**FISCHERSCOPE X-RAY XDLM-C4**型仪器上发展而来的。它尤其适合无损测量薄镀层厚度及材料分析，同时还能全自动测量大规模生产的零部件及印刷线路板。



典型的应用领域有：

1. 测量大规模生产的零部件
2. 测量微小区域上的薄镀层
3. 测量电子工业或半导体工业中的功能性镀层
4. 全自动测量，如印刷线路板中各个测量点的连续自动测量

参数

X射线源 带铍窗口的微聚焦钨管
可调高压 30 kV, 40 kV, 50 kV
孔径（准直器） 4个，可切换
基本滤波片 3个，可更改（标准型仪器：镍，铝，无）

测量区域大小 使用矩形0.05 x 0.05mm准直器，最小的测量点大小约为 \varnothing 0.1 mm。

测量距离 0 ~ 20 mm, 校准范围；
 20 ~ 80 mm, 非校准范围

样品台

- 最大移动距离 255 x 235 mm
- X/Y平台移动速度 \leq 80 mm/s
- X/Y平台移动重复精度 \leq 0.01 mm (单向)
- 可用样品平台面积 300 x 350 mm
- 样品最大高度 140 mm

通用范围

- **用途** 能量色散X射线荧光光谱仪 (EDXRF) 用来测量薄镀层和微小结构，分析合金和微量成分。
- **可测量元素范围** 可测量从氯 (Cl 17) 到铀 (U 92) 中的元素
- **设计理念** 台式仪器，测量门向上开启
- **测量方向** 从上到下